



中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1254—2010

数显测高仪校准规范

Calibration Specification for Height Measuring Instrument
with Digital Display

2010—05—11 发布

2010—11—11 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

数显测高仪校准规范

Calibration Specification for
Height Measuring Instrument
with Digital Display

JJF 1254—2010
代替 JJG 929—1998

本规范经国家质量监督检验检疫总局于 2010 年 5 月 11 日批准，并自 2010 年 11 月 11 日起施行。

归口单位：全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位：中国科学院光电技术研究所

参加起草单位：中国测试技术研究院

本规范由全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

匡 龙（中国科学院光电技术研究所）

耿丽红（中国科学院光电技术研究所）

曹学东（中国科学院光电技术研究所）

参加起草人：

冉 庆（中国测试技术研究院）

目 录

1	范围	(1)
2	引用文献	(1)
3	概述	(1)
4	计量特性	(2)
4.1	测量力	(2)
4.2	垂直度	(2)
4.3	示值变动性	(2)
4.4	示值误差	(2)
5	校准条件	(2)
5.1	环境条件	(2)
5.2	测量标准器及其他设备	(3)
6	校准项目和校准方法	(3)
6.1	测量力	(3)
6.2	垂直度	(3)
6.3	示值变动性	(4)
6.4	示值误差	(4)
7	校准结果表达	(4)
8	复校时间间隔	(4)
	附录 A 数显测高仪示值误差测量结果不确定度评定	(5)
	附录 B 校准证书内容	(8)

数显测高仪校准规范

1 范围

本规范适用于分辨力为 $0.1\ \mu\text{m}$ 、 $0.2\ \mu\text{m}$ 、 $0.5\ \mu\text{m}$ 和 $1\ \mu\text{m}$ ，量程 $0\ \text{mm}$ 至 $1\ 000\ \text{mm}$ 的数显测高仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

JJF 1094—2002 测量仪器特性评定

JJF 1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

GB/T 22094—2008 电子数显测高仪

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

数显测高仪是基于精密机械、现代传感技术和电子技术的立式单坐标数字化几何量测量仪器，用来测量平行平面之间距离、孔和轴直径、中心距以及相关形位误差等。其外形结构见图 1。

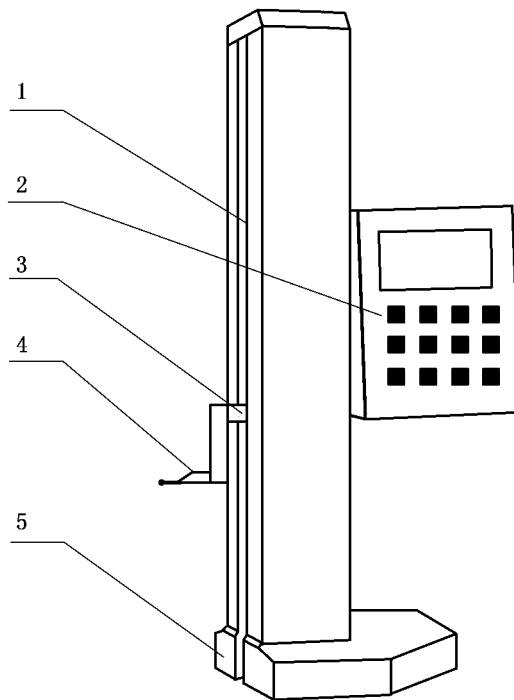


图 1 数显测高仪外形结构示意图

1—立柱；2—控制与显示器；3—测量滑座；4—测头；5—底座